

Материалы XVII Российского симпозиума по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел

Н. А. Кошев, Н. А. Орликовский, Э. И. Рау, А. Г. Ягола Восстановление энергетических спектров отраженных электронов с учетом аппаратной функции спектрометра	1070
В. В. Казьмирук, Т. Н. Савицкая Автоматизация режима электронно-зондового мониторинга дефектов шаблонов для импринт-литографии	1077
А. Н. Поляков, M. Noltemeyer, T. Hempel, J. Christen, М. А. Степович Катодолюминесцентные экспериментальные исследования транспорта экситонов в нитриде галлия	1082
Н. Н. Михеев, М. А. Степович, Е. В. Широкова Учет матричных эффектов при локальном электронно-зондовом анализе с использованием новой модели функции распределения по глубине рентгеновского характеристического излучения	1086
А. В. Кузьменков, П. В. Иванников, А. И. Габельченко Возможности метода катодолюминесценции в рэм для исследования распределения и определения типов пробоев стеклянных изоляторов	1090
А. Н. Пустовит, А. Ф. Вяткин Прецизионное профилирование по глубине структур нанoeлектроники с использованием вторичных молекулярных ионов в методе ВИМС	1095
О. Д. Потапкин, А. А. Мельников Анализ коэффициента сбора РЭМ	1099
О. Д. Потапкин Литография с гауссовым распределением плотности тока в зонде для нанотехнологий	1103
В. В. Привезенцев, М. В. Чукичев, Р. В. Миронов, Ю. В. Кривенков Исследование оптических свойств приповерхностного слоя в кремнии, имплантированном цинком, после термических отжигаов	1107
О. В. Войтенко, Е. Б. Модин, И. С. Смирнов, Е. В. Пустовалов, Б. Н. Грудин, В. С. Плотников, С. С. Грабчиков, Л. Б. Сосновская Электронная томография и морфологический анализ структуры многокомпонентных аморфных и нанокристаллических сплавов	1111
Д. А. Павлов, П. А. Шиляев, Е. В. Коротков, Н. О. Кривулин, А. И. Бобров Исследование КНС-структур методами просвечивающей электронной микроскопии	1115
Б. Г. Завин, Н. В. Черкун, Н. В. Сергиенко, А. А. Анисимов, Л. В. Филимонова, О. В. Силицына, И. В. Яминский, А. Г. Филатова, О. А. Белякова, Я. В. Зубавичус, И. О. Волков, Е. М. Белавцева Исследование структуры нанокомпозитов, полученных разложением металлосилоксанов в полимерных матрицах	1118
С. О. Абетковская, С. А. Чижик, И. В. Погоцкая, З. Римуза, Д. Яжабек, М. Михаловски, Я. Линке Определение модуля упругости покрытий наноразмерной толщины для МЭМС по результатам статической силовой спектроскопии	1122
Е. Б. Модин, О. В. Войтенко, А. П. Глухов, А. В. Кириллов, Е. В. Пустовалов, С. В. Должиков, А. В. Колесников, С. С. Грабчиков, Л. Б. Сосновская <i>In situ</i> исследование структуры электролитически осажденного сплава кобальт–фосфор при нагреве	1125
Б. Н. Грудин, С. В. Должиков, В. С. Плотников, Н. А. Смольянинов, С. В. Полищук	

Устранение искажений непериодических микроструктур на изображениях	1128
Б. Н. Грудин, В. С. Плотников, Е. В. Пустовалов, Н. А. Смольянинов, С. В. Полищук	
Моделирование и анализ изображений с использованием спектральных характеристик	1134
Е. Б. Модин, О. В. Войтенко, И. С. Смирнов, Е. В. Пустовалов, Б. Н. Грудин, А. П. Глухов, А. В. Кириллов, В. С. Плотников, С. С. Грабчиков, Л. Б. Сосновская	
Исследование структуры многослойных магнитных нанопроволок систем Co/Cu, NiFe/Cu	1140
В. И. Николайчик, Б. П. Соболев, М. А. Запорожец, А. С. Авиллов	
Влияние электронного облучения на фториды щелочно-земельных элементов (CaF ₂ , SrF ₂ и BaF ₂)	1143
В. И. Николайчик, Л. А. Клинова, Н. В. Барковский	
Катионная нестехиометрия оксидов систем Ba—Cu—O и Y—Ba—Cu—O	1149
Ю. Н. Бузынин, В. Г. Шенгуров, Б. Н. Звонков, А. Н. Бузынин, О. И. Хрыкин, М. Н. Дроздов, Ю. Н. Дроздов, С. А. Денисов	
Рост и свойства пленок GaAs, GaN и низкоразмерных структур GaAs/QWs InGaAs на подложках Si с буферным слоем Ge	1153
А. Н. Бузынин, В. П. Калинушкин, О. В. Уваров, Э. И. Рау, С. А. Дицман, Ф. А. Лукьянов, В. И. Золотарев, А. П. Лыткин	
Исследование характеристик фоточувствительных элементов матриц фотоприемников на основе Si Pt:Si с помощью метода наведенного потенциала и просвечивающей электронной микроскопии	1158
Б. Б. Алчагиров, Р. Х. Архестов, Т. М. Таова, Х. Б. Хоконов*	
Поверхностное натяжение расплавов бинарных систем щелочных металлов. Система натрия—цезий	1163
А. С. Разинкин, И. И. Огородников, А. Н. Титов, М. В. Кузнецов*	
Структурные дефекты на поверхности 1T-TiSe ₂ : эксперимент и модельные расчеты фотоэлектронной дифракции	1166
А. А. Бабаев, П. П. Хохлачев, Ю. А. Николаев, Е. И. Теруков, А. Б. Фрейдин, Р. А. Филиппов, А. К. Филиппов, Н. К. Манабаев*	
Особенности удельного сопротивления пленок нанокompозита, полученного на основе углеродных многостенных трубок методом направленного спиннинга	1170
М. С. Онегин, А. В. Плавко, В. И. Кудряшов**	
Тестирование эффективных нуклон-нуклонных сил при описании диагональных коэффициентов передачи спина в рассеянии поляризованных протонов с возбуждением уровней 1 ⁺ в ядре ¹² C	1174

* Статьи доложены на Международном междисциплинарном симпозиуме “Упорядочение в минералах и сплавах” (ОМА-14).

** Статья доложена на Международной конференции “Ядро-2011”.